

第6章

保護回路と熱/ノイズ対策の常識

電子機器の信頼性を高める

6-1 半導体の使用温度と熱抵抗、許容損失について教えてください

パワー回路に使用するパワー・デバイスは、絶対最大定格で使用温度が決められています。ほとんどの半導体はチャネル(ジャンクション)温度が150°Cまでです。2SK3911(東芝)の絶対最大定格を表1に示します。表1の絶対最大定格から、チャネル温度が150°Cを超えて使用することはできないことが分かります。

また、機器の信頼性を保つために、絶対最大定格に余裕を持った値(ディレーティング)で使用します。一般的にチャネル温度のディレーティングは80%以下とするので、 $150^{\circ}\text{C} \times 0.8 = 120^{\circ}\text{C}$ 以下のチャネル温度で使用します。

● チャネル温度の求め方

表2に示すチャネル-ケース間熱抵抗は、図1のように、チャネルとケース間の熱抵抗を示しているので、デバイスの損失とケース温度が分かれればチャネル温度が分かります。例えば、2SK3911のデバイス損失 P_D

が60Wで、ケース温度 T_c が50°Cのとき、チャネル温度 T_{ch} [°C]は、

$$T_{ch} = R_{th(ch-c)} \times P_D + T_c$$

から、

$$(0.833^{\circ}\text{C}/\text{W} \times 60 \text{ W}) + 50^{\circ}\text{C} \approx 100^{\circ}\text{C} \dots\dots\dots(1)$$

となります。

表2に示すチャネル-外気間熱抵抗は、図2のように、デバイス単体で使用した場合の熱抵抗を示しています。つまり、周囲温度 T_a が30°Cで、デバイス損失 P_D が1.5Wの場合、

$$T_{ch} = R_{th(ch-a)} \times P_D + T_a$$

から、

$$(50^{\circ}\text{C}/\text{W} \times 1.5 \text{ W}) + 30^{\circ}\text{C} = 105^{\circ}\text{C} \dots\dots\dots(2)$$

となります。

熱抵抗とは熱の伝わりにくさを表し、電気抵抗の計算で使うオームの法則と同じ計算式で算出できます。

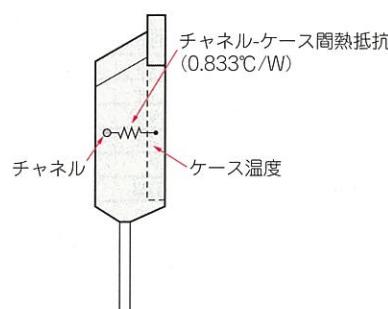


図1 チャネル-ケース間熱抵抗

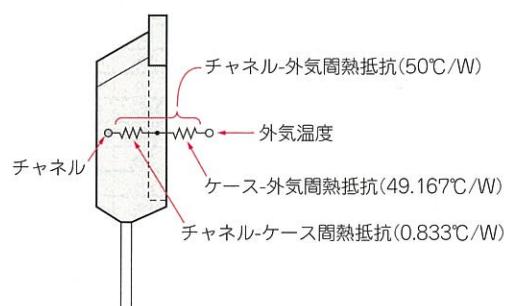


図2 チャネル-外気間熱抵抗

表1⁽¹⁾ MOSFET 2SK3911 の絶対最大定格($T_a = 25^{\circ}\text{C}$)

項目	記号	定 格	単位
ドレン-ソース間電圧	V_{DSS}	600	V
ドレン-ゲート間電圧 ($R_{GS} = 20 \text{ k}\Omega$)	V_{DGR}	600	V
ゲート-ソース間電圧	V_{GSS}	± 30	V
ドレン電流	DC	I_D	A
	パルス	I_{DP}	A
許容損失($T_c = 25^{\circ}\text{C}$)	P_D	150	W
アバランシェ・エネルギー (単発)	E_{AS}	792	mJ
アバランシェ電流	I_{AR}	20	A
アバランシェ・エネルギー (連続)	E_{AR}	15	mJ
チャネル温度	T_{ch}	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55 ~ 150	°C

表2⁽¹⁾ MOSFET 2SK3911 の熱抵抗特性

項目	記 号	最 大	単位
チャネル-ケース間熱抵抗	$R_{th(ch-c)}$	0.833	°C/W
チャネル-外気間熱抵抗	$R_{th(ch-a)}$	50	°C/W